

精密儀器中心

本中心提供多項儀器檢測服務，若各廠商或業者有需要相關檢測服務，
歡迎來電洽詢，中心儀器簡介如下：



穿透式電子顯微鏡/掃描穿透電子影像
裝置/能量發散光譜儀(TEM/STEM/EDS)
觀察試片表面與截面高解
析影像，提供元素分析及
晶格繞射影像。

全新



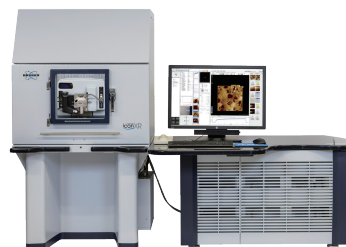
全新

X射線光電子能譜儀/紫外光電子能譜/
低能量反光電子能(XPS/UPS/LEIPS)對
物質表面進行定性及定量的化學分析。

超高解析熱電子型場
發射掃描式電子顯微
鏡/能量發散光譜儀
(FE-SEM/EDS)
觀測試片表面及截面
表面型態及元素分析。



全新



原子力顯微鏡(AFM)
觀測試片表面粗糙度與
膜厚量測，微區電
性、磁性分析。

全新



全新

螢光光譜儀(FL)
量測樣品中激發、放
光光譜與長時間螢光
衰減測定。



全新

顯微拉曼光譜儀(Raman)
藉由分子特性的震動能
譜，以獲得物質的鍵結
、結構等訊息。



輪廓儀
樣品表面微
米級輪廓量
測。

全新



場發式掃描式電子顯微鏡(FE-SEM)
觀測試片表面及截面表
面型態及元素分析。

傅立葉轉換紅外線光譜儀(FTIR)
可檢測薄膜、粉末等固體
之有機官能基。



熱重分析儀(TGA)
測量材料重量隨溫度
或時間的變化。



示差掃描熱分析儀(DSC)
測量的是與材料內部熱
轉變相關的溫度、熱流
的關係。

